СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК АМПЛИТУДНО-ФАЗОВЫХ МЕТОДОВ ВИХРЕТОКОВОГО КОНТРОЛЯ ФЕРРОМАГНИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Горкунов Б.М., к.т.н., доц.

Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" Украина, 61002, Харьков, ул. Фрунзе 21, НТУ "ХПИ", кафедра "Приборы и методы неразрушающего контроля" тел./факс: (057) 707-6380, E-mail: gorkunov@kpi.kharkov.ua

В роботі розглянуто декілька методів спільного безконтактного контролю магнітної проникності та питомого електричного опору феромагнітних виробів з допомогою вихорострумових трансформаторних перетворювачів. Одержано основні математичні співвідношення для розрахунку чутливостей та похибок контролю, проведено порівняний аналіз роботи перетворювачів за метрологічними характеристиками.

В работе рассмотрено несколько методов совместного контроля магнитной проницаемости и удельного электрического сопротивления ферромагнитных изделий с помощью вихретоковых трансформаторных преобразователей. Получены основные математические соотношения для расчета чувствительностей и погрешностей контроля, проведен сравнительный анализ работы преобразователя по метрологическим характеристикам.

Многие узлы агрегатов и механизмов в энергетике, машиностроении и приборостроении выполнены из ферромагнитных материалов и подвергаются различным механическим воздействиям, которые, в конечном счете, приводят к изменению магнитных и электрических параметров ферромагнитного изделия. Поскольку относительная магнитная проницаемость μ_r и удельное электрическое сопротивление ρ функционально связаны с механическим напряжением $\sigma_{\rm M}$, то, определяя их, можно контролировать прочностные характеристики металлических изделий [1, 2]. Известно много методов и устройств бесконтактного определения электромагнитных параметров ферромагнитных изделий [3]. Особое место занимают вихретоковые методы и преобразователи для бесконтакт-

ного контроля μ_r и ρ, причем, каждый из них имеет рациональные по точности и чувствительности диапазоны контроля и условия их применения [4]. Данная работа посвящена анализу работы вихретоковых преобразователей при реализации различных методов одновременного бесконтактного контроля μ_r

и ρ ферромагнитных изделий и выбору оптимальных по метрологическим характеристикам того или иного метода для различных объектов и условий контроля.

В работах [4, 5] рассмотрены вихретоковые методы и преобразователи для совместного бесконтактного контроля μ_r и ρ ферромагнитных изделий, основанные на измерении трех ЭДС вихретокового преобразователя (ВТП) и соответствующих универсальных функций преобразования.

Данная работа посвящена проведению сравнительного анализа трех методов реализации вихретокового контроля μ_r и ρ, которые основаны на измерении суммарной ЭДС и ее фазы, вносимой ЭДС и ее фазы, а также измерении ЭДС и фазы выходного сигнала ВТП при компенсации части ЭДС, пропорциональной магнитному потоку в воздушном зазоре. Как будет показано ниже, алгоритмы, реализующие рассматриваемые в работе методы, состоят из расчетных и измерительных операций. В связи с развитием микропроцессорной техники. погрешности, возникающие при выполнении расчетных операций, достаточно малы и ими можно пренебречь. Что же касается первичного и вторичного преобразования (измерительные операции), то в этом случае для оценки метрологических параметров (погрешности и чувствительности) необходимо знать схему включения преобразователя и метрологические характеристики измерительной аппаратуры, используемой для реализации того или иного метода контроля.

Принципиальная схема включения ВТП, с помощью которой можно реализовать все три метода бесконтактного контроля μ_r и ρ , приведена на рис. 1, а векторная диаграмма напряжений ВТП, поясняющая его работу, приведена на рис. 2.



Рис. 2. Векторная диаграмма тока, ЭДС и их фаз ВТП с ферромагнитным изделием

Преобразователь состоит из двух идентичных трансформаторов Tp1 и Tp2 (см. рис. 1), в первом находится исследуемый ферромагнитный образец О, а второй имеет возможность изменять количество витков вторичной (измерительной) обмотки от 0 до W_{max} . Так как вторичные обмотки Tp1 и Tp2 включены последовательно-встречно, то на выходе ВTП можем получать значения напряжений U_{Σ} (если $W_{\text{изм}_{\text{Tp2}}} = 0$), $U_{\text{вн}}$ (если $W_{\text{изм}_{\text{Tp2}}} = W_{\text{max}}$) и U_2 (если $W_{\text{изм}_{\text{Tp2}}}$ будет подобрано таким образом, чтобы на выходе вторичной обмотки Tp2 было напряжение $U_1 = U_{\Sigma0}(1-\eta)$, где $\eta = d^2/d_{\Pi}^2$ - коэффициент заполнения; d – диаметр образца; d_{Π} – диаметр вторичной обмотки преобразователя; $U_{\Sigma0}$ – ЭДС преобразователя без изделия). При

этом, фазометр Φ будет измерять фазовые углы $\frac{\pi}{2} + \phi_{\Sigma}$,

 $\frac{\pi}{2} - \phi_{BH}$ и $\frac{\pi}{2} + \phi_2$ соответственно.

Для того, чтобы качественно сравнить работу ВТП для реализации трех методов одновременного определения μ_r и р ферромагнитных изделий необходимо получить основные соотношения, описывающие данный метод, провести и получить экспериментальные данные измерений ЭДС, их фаз и других параметров преобразователя, а также описать алгоритм последовательности измерительных и расчетных процедур. Затем получить выражения для оценки поведения погрешностей и чувствительностей в широком диапазоне изменения режимов работы преобразователя и после этого провести сравнительный анализ метрологических характеристик ВТП для трех методов контроля μ_r и р.

Получим основные расчетные соотношения для реализации метода бесконтактного одновременного определения μ_r и ρ ферромагнитного изделия при измерении U_{Σ} и ϕ_{Σ} выходного сигнала ВТП. Используя результаты работы [6] и векторную диаграмму (см. рис. 2), можно записать:

$$tg\varphi_2 = \frac{U_{\Sigma}\sin\varphi_{\Sigma}}{U_{\Sigma}\cos\varphi_{\Sigma} - U_1}; \qquad (1)$$

$$U_2 = \mu_r \eta U_{\Sigma 0} K , \qquad (2)$$

где U_2 и tg φ_2 – ЭДС и фаза, пропорциональные магнитному потоку и его фазе внутри исследуемого изделия; K – удельный нормированный магнитный поток, который однозначно зависит от обобщенного параметра x.

Причем, как известно [6]:

$$x = \frac{d}{2} \sqrt{\frac{\mu_0 \mu_r 2\pi f}{\rho}}, \qquad (3)$$

где $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} \, \Gamma$ н/м – магнитная постоянная; *f* – частота зондирующего поля.

Используя выражение (2), с учетом того, что $U_2 = U_{\Sigma} \sin \varphi_{\Sigma} / \sin \varphi_2$ – теорема синусов (см. рис. 2), получим:

$$\mu_r = \frac{U_{\Sigma} \sin \varphi_{\Sigma}}{U_{\Sigma 0} \eta K \sin \varphi_2} = \frac{U_{\Sigma} \sin \varphi_{\Sigma}}{\eta U_{\Sigma 0} \operatorname{Im} K}, \qquad (4)$$

где Im K – универсальная функция, которая связана через x с функцией tg φ_2 , т.е. Im $K = f_1(tg\varphi_2)$.

Подставив выражение (4) в (3), получим:

$$\rho = \frac{\mu_0 \pi d_{\Pi}^2 f U_{\Sigma} \sin \varphi_{\Sigma}}{2 U_{\Sigma 0} K_{\rho}}, \qquad (5)$$

где K_{ρ} – универсальная функция преобразования, которая через параметр *x* связана с функцией $tg\phi_2$, т.е. $K_{\rho} = f_2(tg\phi_2)$.

Аналогичным образом, при реализации второго метода определения μ_r и ρ по измеренным значениям $U_{\rm BH}$ и $\phi_{\rm BH}$, получим основные расчетные соотношения.

Из векторной диаграммы (см. рис. 2) можно получить:

$$tg\phi_2 = \frac{U_{\rm BH}\sin\phi_{\rm BH}}{U_{\rm BH}\cos\phi_{\rm BH} + U_{20}},$$
 (6)

где $U_{20} = \eta U_{\Sigma 0} - \exists \exists C$ преобразователя, пропорциональна магнитному потоку преобразователя без изделия на размере исследуемого изделия.

Используя выражение (2), а также по теореме синусов (см. рис. 2) $U_2 = U_{\rm BH} \sin \varphi_{\rm BH} / \sin \varphi_2$, получим:

$$\mu_r = \frac{U_{\rm BH} \sin \varphi_{\rm BH}}{\eta U_{\Sigma 0} \, {\rm Im} K} \,. \tag{7}$$

Аналогично для р, получим:

$$\rho = \frac{\mu_0 \pi d_{\Pi}^2 f U_{\rm BH} \sin \varphi_{\rm BH}}{2 U_{\Sigma 0} K_{\rho}} \,. \tag{8}$$

Третий метод совместного определения μ_r и ρ заключается в том, что вначале компенсируют часть ЭДС преобразователя, пропорциональную магнитному потоку в зазоре, а после этого измеряют U_2 и φ_2 . Зная φ_2 , по функциональной зависимости $K = f_3(\varphi_2)$ [6], находят K, а на основании формулы (2) μ_r определяют как:

$$\mu_r = \frac{U_2}{\eta U_{\Sigma 0} K} = \frac{U_2}{U_{20} K}.$$
(9)

Значение р определяют из выражения:

$$\rho = \frac{\mu_0 \pi d_{\Pi}^2 f U_2}{2 U_{\Sigma 0} N} \,, \tag{10}$$

где $N = x^2 K$ – универсальная функция преобразования, которая зависит от φ_2 , т.е. $N = f_4(\varphi_2)$.

Таким образом, получим совмещенный универсальный алгоритм последовательности измерительных и расчетных операций для реализации трех методов одновременного контроля μ_r и ρ ферромагнитных изделий, который приведен на рис. 3.

Одной из важных метрологических характеристик вихретоковых преобразователей является его чувствительность. Для сравнительной оценки по чувствительности ВТП, реализующих три метода одновременного контроля μ_r и ρ , вначале получим выражения, которые связывают параметры выходного сигнала преобразователя с параметрами объекта контроля и режимом работы ВТП (т.е. с обобщенным параметром *x*). Так, используя векторную диаграмму (см. рис. 2), для схемы включения преобразователя с измерением U_{Σ} и ϕ_{Σ} получим:

$$U_{\Sigma} = U_{\Sigma 0} \sqrt{(\eta \mu_r K)^2 + 2\eta (1 - \eta) \mu_r K \cos \varphi_2 + (1 - \eta)^2} ;(11)$$

$$\varphi_{\Sigma} = \arctan\left(\frac{\mu_r \eta K \sin \varphi_2}{\mu_r \eta K \cos \varphi_2 + 1 - \eta}\right).$$
(12)

Електротехніка і Електромеханіка. 2007. №5



Рис. 3. Совмещенный алгоритм определения µ_r и р

Для схемы с измерением $U_{\rm BH}$ и $\phi_{\rm BH}$ аналогично:

$$U_{\rm BH} = \eta U_{\Sigma 0} \sqrt{(\mu_r K)^2 - 2\mu_r K \cos \varphi_2 + 1}; \quad (13)$$

$$\varphi_{\rm BH} = \arctan\left(\frac{\mu_r K \sin \varphi_2}{\mu_r K \cos \varphi_2 - 1}\right). \tag{14}$$

В случае использования схемы включения ВТП с частичной компенсацией ЭДС, пропорциональной потоку в воздушном зазоре, на выходе преобразователя будем иметь значение ЭДС U_2 , которое определяется по формуле (2), и непосредственно фазовый угол φ_2 , совпадающий с фазовым углом магнитного потока в изделии. Так как сравнивать различные методы реализации ВТП возможно только по относительным чувствительностям, то, исходя из выражений (2) и (11) - (14), получим формулы для расчета относительных чувствительностей ВТП по напряжению и фазе, т.е.

$$S_{U_{\Sigma}} = \frac{\partial U_{\Sigma} / U_{\Sigma 0}}{\partial x} =$$

$$= \eta \mu_{r} \frac{\left[\eta \mu_{r} K + (1-\eta) \cos \varphi_{2}\right] \frac{\partial K}{\partial x} + K(1-\eta) \frac{\partial \cos \varphi_{2}}{\partial x}}{\sqrt{(\eta \mu_{r} K)^{2} + 2\eta \mu_{r} (1-\eta) K \cos \varphi_{2} + (1-\eta)^{2}}}; (15)$$

$$S_{\varphi_{\Sigma}} = \frac{\partial \varphi_{\Sigma}}{\partial x} =$$

$$= \eta \mu_{r} \frac{\frac{\partial K}{\partial x} (1-\eta) \sin \varphi_{2} + K [\eta \mu_{r} K + (1-\eta) \cos \varphi_{2}] \frac{\partial \varphi_{2}}{\partial x}}{(\eta \mu_{r} K)^{2} + 2\eta \mu_{r} (1-\eta) K \cos \varphi_{2} + (1-\eta)^{2}}; (16)$$

$$S_{U_{BH}} = \frac{\frac{\partial U_{BH} / U_{\Sigma 0}}{\partial x}}{\partial x} = \eta \mu_{r} \frac{(\mu_{r} K - \cos \varphi_{2}) \frac{\partial K}{\partial x} - K \frac{\partial \cos \varphi_{2}}{\partial x}}{\sqrt{(\mu_{r} K)^{2} - 2\mu_{r} K \cos \varphi_{2} + 1}}; (17)$$

 $S_{\varphi_{\rm BH}} = \frac{\partial \varphi_{\rm BH}}{\partial x} = \mu_r \frac{K(\mu_r K - \cos \varphi_2) \frac{\partial \varphi_2}{\partial x} - \frac{\partial K}{\partial x} \sin \varphi_2}{(\mu_r K)^2 - 2\mu_r K \cos \varphi_2 + 1}; (18)$

$$S_{U_2} = \frac{\partial U_2 / U_{\Sigma 0}}{\partial x} = \eta \mu_r \frac{\partial K}{\partial x}; \qquad (19)$$

$$S_{\varphi_2} = \frac{\partial \varphi_2}{\partial x}, \qquad (20)$$

где $\partial K/\partial x$, $\partial \phi_2/\partial x$, $\partial \cos \phi_2/\partial x$ – частные производные универсальных функций преобразования, которые определяются для каждой рабочей точки преобразователя.

Для построения экспериментальных зависимостей относительных чувствительностей по амплитуде и фазе выходного сигнала от обобщенного параметра *x* в работе использовался трансформаторный ВТП с параметрами: $d_{\Pi} = 16,2$ мм; $l_{\Pi} = 176$ мм; напряженность поля $H_0 = 100$ А/м. Для исследования были выбраны два образца: нержавеющая сталь X18H10T (с параметрами: d = 10 мм; $\mu_r = 1,5$; $\rho = 0,715 \cdot 10^{-6}$ Ом·м) и сталь 45 (с параметрами: d = 10 мм; $\mu_r = 100$; $\rho = 0,2 \cdot 10^{-6}$ Ом·м). Изменение параметра *x* осуществлялось изменением частоты зондирующего поля.

На рис. 4 а-е представлены зависимости относительных чувствительностей по амплитуде и фазе выходного сигнала ВТП для трех методов одновременного контроля μ_r и ρ .

Вторым важным метрологическим параметром ВТП является погрешность одновременного определения μ_r и р. В нашем случае, поскольку рассматриваемые методы являются косвенными, то, используя результаты работы [7], получим выражения для оценки погрешностей контроля γ_{μ} и γ_{ρ} для каждого метода. Для этого, используя выражения (4) и (5), найдем соотношения для определения неисключенной систематической составляющей погрешности при доверительной вероятности 0,95 в виде:

$$\begin{split} \gamma_{\mu} &= k \sqrt{\gamma_{U_{\Sigma}}^{2} + (\varphi_{\Sigma} \operatorname{ctg} \varphi_{\Sigma})^{2} \gamma_{\varphi_{\Sigma}}^{2} + \gamma_{U_{\Sigma0}}^{2} + 4\gamma_{d_{\Pi}}^{2} + \gamma_{lmK}^{2}}; (21) \\ \gamma_{\rho} &= k \sqrt{\gamma_{U_{\Sigma}}^{2} + (\varphi_{\Sigma} \operatorname{ctg} \varphi_{\Sigma})^{2} \gamma_{\varphi_{\Sigma}}^{2} + \gamma_{U_{\Sigma0}}^{2} + 4\gamma_{d_{\Pi}}^{2} + \gamma_{f}^{2} + \gamma_{K_{\rho}}^{2}}; (21) \end{split}$$

где k = 1,11 – коэффициент надежности при доверительной вероятности 0,95; $\gamma_{U_{\Sigma}}$, $\gamma_{U_{\Sigma 0}}$, $\gamma_{\phi_{\Sigma}}$, γ_{d} , $\gamma_{d_{\Pi}}$, γ_{f} – погрешности определения параметров указанных в индексах; $\gamma_{\text{Im}K}$ и $\gamma_{K_{\rho}}$ – погрешности определения значений Im K и K_{ρ} из универсальных функциональных зависимостей Im $K = f_1(\text{tg } \phi_2)$ и $K_{\rho} = f_2(\text{tg } \phi_2)$ в точке, соответствующей полученному значению tg ϕ_2 из формулы (1), которые можно определить из выражений:

$$\gamma_{\mathrm{Im}K} = \frac{f_1'(\mathrm{tg}\,\varphi_2)\,\mathrm{tg}\,\varphi_2}{f_1(\mathrm{tg}\,\varphi_2)}\gamma_{\mathrm{tg}\,\varphi_2} = A_1\gamma_{\mathrm{tg}\,\varphi_2}\,;\quad(23)$$

$$\gamma_{K_{\rho}} = \frac{f_2'(\operatorname{tg} \varphi_2) \operatorname{tg} \varphi_2}{f_2(\operatorname{tg} \varphi_2)} \gamma_{\operatorname{tg} \varphi_2} = A_2 \gamma_{\operatorname{tg} \varphi_2} \,. \tag{24}$$

Значения коэффициентов *A*₁ и *A*₂ можно определять по конечным приращениям аргумента и функции в рабочей точке по формулам:

$$A_{1} = \frac{\Delta \operatorname{Im} K \operatorname{tg} \varphi_{2}}{\Delta \operatorname{tg} \varphi_{2} \operatorname{Im} K}; \qquad (25)$$

Електротехніка і Електромеханіка. 2007. №5



г) д) е) Рис. 4. Зависимости относительных чувствительностей по амплитуде и фазе для случаев измерения: U_{Σ} и ϕ_{Σ} (a, б); $U_{\rm BH}$ и $\phi_{\rm BH}$ (в, г); U_2 и ϕ_2 (д, е)

$$A_2 = \frac{\Delta K_{\rho} \, \mathrm{tg} \, \varphi_2}{\Delta \, \mathrm{tg} \, \varphi_2 \, K_{\rho}},\tag{26}$$

где $\Delta \text{Im} K$, ΔK_{ρ} и $\Delta \text{tg} \varphi_2$ – бесконечно малые прира-

щения аргумента и функций вблизи рабочей точки tg ϕ_2 . Причем, используя выражение (1), по аналогичной методике получим:

$$\gamma_{tg \phi_2}^2 = (a_1 \gamma_{U_{\Sigma}})^2 + (a_2 \gamma_{\phi_{\Sigma}})^2 + (a_3 \gamma_{U_{\Sigma 0}})^2 + (a_4 \gamma_{\eta})^2, (27)$$

где *a*₁, *a*₂, *a*₃ и *a*₄ – коэффициенты влияния, которые определяются как частные производные по измеренным параметрам и равны соответственно:

$$a_{1} = \frac{\partial \operatorname{tg} \varphi_{2} U_{\Sigma}}{\partial U_{\Sigma} \operatorname{tg} \varphi_{2}} = 1 - \frac{U_{\Sigma} \cos \varphi_{\Sigma}}{U_{\Sigma} \cos \varphi_{\Sigma} - U_{\Sigma 0} (1 - \eta)}; \quad (28)$$

$$a_{2} = \frac{\partial \operatorname{tg} \varphi_{2} \varphi_{\Sigma}}{\partial \varphi_{\Sigma} \operatorname{tg} \varphi_{2}} = \frac{\varphi_{\Sigma} [U_{\Sigma} - U_{\Sigma 0} (1 - \eta) \cos \varphi_{\Sigma}]}{\sin \varphi_{\Sigma} [U_{\Sigma} \cos \varphi_{\Sigma} - U_{\Sigma 0} (1 - \eta)]}; (29)$$

$$a_{3} = \frac{\partial \operatorname{tg} \varphi_{2} U_{\Sigma 0}}{\partial U_{\Sigma 0} \operatorname{tg} \varphi_{2}} = \frac{U_{\Sigma 0}(1-\eta)}{U_{\Sigma} \cos \varphi_{\Sigma} - U_{\Sigma 0}(1-\eta)}; \quad (30)$$

$$a_4 = \frac{\partial \operatorname{tg} \varphi_2 \eta}{\partial \eta \operatorname{tg} \varphi_2} = \frac{\eta U_{\Sigma 0}}{U_{\Sigma 0} (1 - \eta) - U_{\Sigma} \cos \varphi_{\Sigma}} .$$
(31)

Аналогичным образом можно найти выражения для оценки погрешностей контроля μ_r и ρ вторым методом, при этом, используя выражения (6) - (8), получим:

$$\gamma_{\mu} = k_{\sqrt{\gamma_{U_{BH}}^{2} + (\varphi_{BH} \operatorname{ctg} \varphi_{BH})^{2} \gamma_{\varphi_{BH}}^{2} + \gamma_{U_{\Sigma0}}^{2} + 4\gamma_{d}^{2} + 4\gamma_{d_{\Pi}}^{2} + \gamma_{ImK}^{2}}; (32)}$$

$$\gamma_{\rho} = k_{\sqrt{\gamma_{U_{BH}}^{2} + (\varphi_{BH} \operatorname{ctg} \varphi_{BH})^{2} \gamma_{\varphi_{BH}}^{2} + \gamma_{U_{\Sigma0}}^{2} + 4\gamma_{d_{\Pi}}^{2} + 4\gamma_{f}^{2} + \gamma_{K_{\rho}}^{2}}}, (33)$$

где $\gamma_{\text{Im}K}$ и $\gamma_{K_{\rho}}$ – определяют по формулам (23) - (26), а $\gamma_{\text{tg}\,\phi_{2}}$, используя выражение (6) находят как:

 $\gamma_{tg \phi_2}^2 = (e_1 \gamma_{U_{BH}})^2 + (e_2 \gamma_{\phi_{BH}})^2 + (e_3 \gamma_{U_{\Sigma 0}})^2 + (e_4 \gamma_{\eta})^2$, (34) где e_1, e_2, e_3 и e_4 – коэффициенты влияния, которые равны соответственно:

$$e_1 = \frac{\partial \operatorname{tg} \varphi_2 U_{\rm BH}}{\partial U_{\rm BH} \operatorname{tg} \varphi_2} = 1; \qquad (35)$$

$$e_{2} = \frac{\partial \operatorname{tg} \varphi_{2} \varphi_{BH}}{\partial \varphi_{BH} \operatorname{tg} \varphi_{2}} = \frac{\varphi_{BH} (U_{BH} + \eta U_{\Sigma 0} \cos \varphi_{BH})}{\sin \varphi_{BH} (U_{BH} \cos \varphi_{BH} + U_{\Sigma 0} \eta)};(36)$$

$$e_3 = \frac{\partial \operatorname{tg} \varphi_2 U_{\Sigma 0}}{\partial U_{\Sigma 0} \operatorname{tg} \varphi_2} = -\frac{\eta U_{\Sigma 0}}{U_{\operatorname{BH}} \cos \varphi_{\operatorname{BH}} - U_{\Sigma 0} \eta}; \quad (37)$$

$$\epsilon_4 = \frac{\partial \operatorname{tg} \varphi_2 \eta}{\partial \eta \operatorname{tg} \varphi_2} = -\frac{\eta U_{\Sigma 0}}{U_{\text{BH}} \cos \varphi_{\text{BH}} - U_{\Sigma 0} \eta} \,. \tag{38}$$

И наконец, для третьего метода реализации, используя выражения (9) и (10) получим:

$$\gamma_{\mu} = k \sqrt{\gamma_{U_2}^2 + \gamma_{U_{20}}^2 + \gamma_K^2 + \gamma_{HK}^2} ; \qquad (39)$$

$$\gamma_{\rho} = k \sqrt{\gamma_{U_2}^2 + \gamma_{U_{\Sigma 0}}^2 + \gamma_f^2 + \gamma_N^2 + \gamma_{HK}^2} , \qquad (40)$$

где $\gamma_{\rm HK}$ – погрешность недокомпенсации, которая имеет второй порядок малости и может не учитываться, а γ_K и γ_N находят из выражений:

$$\gamma_{K} = \frac{f'_{3}(\phi_{2})\phi_{2}}{f_{3}(\phi_{2})}\gamma_{\phi_{2}} = A_{3}\gamma_{\phi_{2}}; \qquad (41)$$

$$\gamma_N = \frac{f_4(\varphi_2)\varphi_2}{f_4(\varphi_2)}\gamma_{\varphi_2} = A_4\gamma_{\varphi_2}, \qquad (42)$$

где A_3 и A_4 – коэффициенты влияния, которые определяются аналогичным образом, как A_1 и A_2 ; γ_{φ_2} – погрешность фазометра.

Для получения зависимостей погрешностей контроля γ_{μ} и γ_{ρ} от обобщенного параметра *x* для трех

методов реализации в эксперименте использовались приборы с высокими точностными характеристиками: по напряжению $\gamma_U \approx 0,2$ % (вольтметр B7-34); по фазе $\gamma_{\phi} \approx 0,2$ % (фазометр Ф2-34); по частоте $\gamma_f \approx 0,1$ % (частотомер Ч3-34); измерение геометрических размеров осуществлялось с погрешностью $\gamma_d \approx 0,1$ %; погрешность недокомпенсации $\gamma_{\rm HK}$ составляла менее

0,01 %, а точность определения коэффициентов влияния достаточно высока, т.к. они находились расчетным путем.

На рис. 5 а-е приведены зависимости относительных погрешностей одновременного бесконтактного контроля γ_{μ} и γ_{ρ} от обобщенного параметра *x* для трех методов.



Рис. 5. Зависимости относительных погрешностей γ_μ и γ_ρ от обобщенного параметра *x* для первого (а, б), второго (в, г) и третьего (д, е) методов контроля

Анализ поведения зависимостей относительных чувствительностей по амплитуде и фазе ВТП (см. рис. 4 а-е) показывает, что для всех методов существует диапазон изменения х, при котором достигаются максимальные значения чувствительностей S_U и S_o. Абсолютные же значения различны и наибольшую чувствительность ВТП имеет при реализации метода с компенсацией магнитного потока в воздушном зазоре (см. рис. 4 д, е), для которого $S_{U_2} \approx 25 \ (1 < x < 2)$ и $S_{\phi_2} \approx 15$ (1,5 < x < 2,5). Следует отметить, что и погрешности определения γ_{μ} и γ_{ρ} для этого метода меньше, чем у других методов и составляют $\gamma_{\rm u} \approx$ 0,4 % (0,5 < *x* < 3,0) и γ₀ ≈ 0,5 % (0,5 < *x* < 3,5). Однако, трудоемкость реализации данного метода намного сложнее и эффективнее использовать его, когда геометрические размеры ВТП и контролируемых образцов неизменны. Что же касается двух других методов одновременного контроля μ_r и ρ , то более предпочтительным оказывается метод, основанный на измерении U_{вн} и $\phi_{\rm BH}$, особенно для исследуемых образцов с малыми значениями µ_r (нержавеющие стали, парамагнитные чугуны и т.д.) и малыми значениями коэффициента заполнения (диаметрами изделия).

Результаты работы позволяют сделать вывод, что у каждого метода есть свои преимущества и недостатки, а выбор того или иного метода будет, в конечном счете, определяться поставленной задачей по достижению необходимых метрологических параметров в заданных режимах работы преобразователя и сортамента контролируемых изделий.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Измерения, контроль, испытания и диагностика. Т. III-7 / В.В. Клюев, Ф.Р. Соснин, В.Н. Филинов и др.; Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, – 1996. – 464 с.
- [2] Спектор С.А. Электрические измерения физических величин. Л.: Энергоатомиздат, 1987. 320 с.
- [3] Неразрушающий контроль: Справочник. В 7 т. Т. 2 / Под общ. ред. В.В. Клюева. – М.: Машиностроение, – 2003. – 688 с.
- [4] Горкунов Б.М., Тюпа И.В. Вихретоковый двухпараметровый контроль ферромагнитных цилиндрических изделий // Вісник Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут". Зб. наук. праць. – Харків НТУ "ХПІ". – № 5. – 2004. – С. 93-99.
- [5] Горкунов Б.М., Тюпа И.В. Точностные характеристики бесконтактного одновременного измерения магнитной проницаемости и электропроводности // Технічна електродинаміка. Тематичний випуск. – Київ: Інститут електродинаміки НАН України. – Ч. 3. – 2005. – С. 97-100.
- [6] Бондаренко В.И., Горкунов Б.М., Себко В.П., Тюпа В.И. Бесконтактные измерения электромагнитных характеристик цилиндрических изделий // Измерительная техника. – № 6. – 1984. – С. 57-58.
- [7] Захаров И.П., Кукуш В.Д. Теория неопределенности в измерениях. Уч. пособие. Харьков. 2002. 256 с.

Надійшла 27.11.2006